SI221 Bases de l'apprentissage/Machine Learning for Pattern Recognition

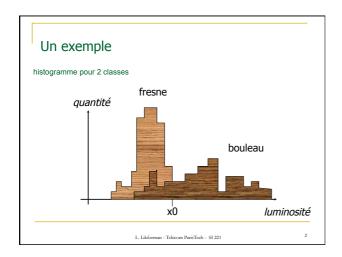
Décision bayésienne

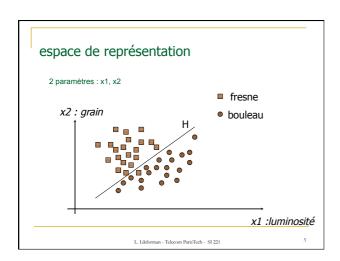
Septembre 2018

Laurence Likforman-Sulem Telecom ParisTech/IDS Image, Données, SIgnal bureau : E 504

likforman@telecom-paristech.fr







théorie de la Décision

- approche par modélisation
- minimise globalement le risque d'erreur
 - connaissances sur les distributions sous jacentes

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

Espace probabilisable: Ω , $F(\Omega)$

- Ω : espace des formes (épreuves)
 Ω = {événements élémentaires}
- F(Ω) : ensemble de parties de Ω événement = sous-ensemble de Ω (partie de Ω)

 Ω est divisé en ensembles disjoints (les classes) $\omega 1,\,\omega 2,\,....,\,\omega k$ avec

$$\omega_i \cap \omega_j = \phi \qquad \forall i \neq j$$

$$| \omega_i = \Omega$$

ω1, ω2,, ωk = système complet d'événements

Espace probabilisé: Ω , $F(\Omega)$, P

- Ω , $F(\Omega)$: est muni d'une probabilité P
- P : $F(\Omega) --> [0,1]$

 $P(\Omega)=1$ $P(\phi)=0$

 $\forall A \ 0 \le P(A) \le 1$ $A \in F(\Omega)$: A événement, partie de Ω $\forall A, B \quad \text{si} \quad A \cap B = \emptyset \quad \text{alors} \quad P(A \cup B) = P(A) + P(B)$ $A, B \in F(\Omega) \times F(\Omega)$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

Espace des classes, ensemble de caractéristiques espace des classes -> ensemble des étiquettes $J = \{1, 2, K\}$ espace de représentation -> ensemble des caractéristiques ex : R= Rd L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 variables/vecteurs aléatoires A chaque forme ω sont associées : variable aléatoire de classe : C (ω) $C: \Omega \longrightarrow J$ vecteur aléatoire correspondant à la réalisation x : X(ω) $X: \Omega \to R^d$ $\omega \mapsto x$ • On observe la réalisation x de X, issue d'une forme de classe C L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 Fonction de décision • on cherche la fonction de décision : Rd --> J • qui estime au mieux la classe , i.e. d(x)=estimation de la classe $C(\omega)$ de la forme

ω dont la réalisation est X(ω)=x

L. Likforman - Telecom Paris Tech - SI 221

exemple : les planches de bois

 Ω = ensemble des planches de frêne et de bouleau

 $J = \{ 1 = frêne, 2=bouleau \}$

X= (indice de luminosité, indice relatif à la texture)

ensemble des caractéristiques $\,:\, R^2$

on a
$$\omega 1 = C^{-1}(1)$$
 $\omega 2 = C^{-1}(2)$

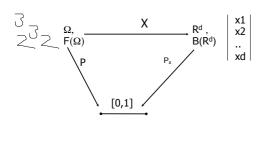
L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

Loi de probabilité associée à un vecteur aléatoire

- vecteur aléatoire X: $\Omega \longrightarrow R^d$
- on probabilise Rd par Px (loi image)
 - (R^d , B(R^d), P_x): espace probabilisé
 - B(R^d): tribu des Boréliens (famille d'intervalles dans R, de pavés dans R^d)
 - P_X: B(R^d) → [O,1] $P_X(A) = P(X^{-1}(A)) + P(\{\omega \in F(\Omega) | X(\omega) \in A\})$ $A \in B(R^d)$ noté $P(X \in A)$

I. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

Probabilité et loi de probabilité (loi image)



L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 - 09/2011

13

fonction de répartition, densité de probabilité

•
$$F_X : \mathbb{R}^d \longrightarrow [0,1]$$

$$X = (X_1, X_2, \dots, X_d)$$

$$x = (x_1, x_2, ..., x_d)$$

$$F_X(x) = P_X(] - \infty, x_1 [\times] - \infty, x_2 [\times ...] - \infty, x_d]) = P_X(X_1 < x_1, X_2 < x_2, ... X_d < x_d)$$
 noté $P(X < x)$

densité de probabilité p_X associée à X (X admet une densité)

$$F_X(x) = \int\limits_{]-\infty,x_1} p_X(u) du \quad \text{not\'e} \int\limits_{]-\infty,x_1} p \int\limits_{]\infty,x_1} u du$$

$$P_X(A) = P(X \in A) = \int_{A} p(x) dx$$
 $A \in B(\mathbb{R}^d)$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2011

densité de probabilité conditionnelle

• densités conditionnelles:

$$P_{X|\alpha i}\left(A\right) = P(X \in A|\alpha i) = \int_{A} p(x|\alpha i) dx \qquad A \in \mathsf{B}(\mathsf{R}^d)$$

$$P(X \in A \mid C = i) \Leftrightarrow P(\{\omega \mid X(\omega) \in A \ sachant \ C(\omega) = i\})$$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2011

densités de probabilités

densités jointes

$$P_{XY}(A,B) = P(X \in A \text{ et } Y \in B) = \iint_{P} p(x,y) dxdy$$

$$P(X \in A, \omega_i) = \int_A p(x, \omega_i) dx = \int_A p(x|\omega_i) P(\omega_i) dx$$

densités marginales

$$p(x) = \int_{pd} p(x, y) dy \qquad p(y) = \int_{pd} p(x, y) dx$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2011

Densités de probabilités (suite)

$$\int_{R^d} p(x|\omega_i)dx = 1 \text{ et } \int_{R^d} p(x)dx = 1$$

• densité mélange

$$p(x) = \sum_{i=1}^{K} p(x \mid \omega_i) P(\omega_i)$$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

probabilités a priori, a posteriori

probabilité a priori de la classe i : P(ωi)=P(C=i)

$$\sum^K P(\omega_i) = 1$$

• probabilité a posteriori

$$P(\omega_i|x) \Leftrightarrow P(C=i|X=x) \Leftrightarrow P(\{\omega|C(\omega)=i \ sachant \ X(\omega)=x\})$$

$$\sum_{i=1}^K P(\omega_i | x) = 1$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

formule de Bayes

$$P(\omega_i | x) = \frac{p(x | \omega_i) P(\omega_i)}{p(x)}$$

$P(\omega_i|x)$: probabilité a posteriori

 $P(\omega_i)$: probabilité a priori p(x): densité "mélange"

P(A|B)=P(A,B)/P(B)

P(A,B)=P(B|A)P(A)

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 = 2010

coûts de décision

- λ(ωi I ωj)= coût de décider d(x)=i pour une réalisation x appartenant à la classe ω j
- «classe» de rejet : ω0 K+1 décisions , K classes $\lambda(\omega 0 \mid \omega j) = \text{coût de rejet} \quad j=1,2,...K$
- On cherche d : la règle de décision la moins coûteuse possible

I. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

risques (1)

• risque conditionnel de prendre la décision d(x)=i espérance de la fonction $\boldsymbol{\lambda}$:

$$C(\textbf{d(x)}=\textbf{i}\mid\textbf{x}) = C_{\textbf{i}}(\textbf{x}) = \sum_{j=1}^{K} \lambda(\ \omega\textbf{i}\mid\omega\textbf{j}\)\ P\ (\omega\textbf{j}\mid\textbf{x})$$
 • risque conditionnel associé à la décision d(x)

$$C(d(x) \mid x) = \sum_{j=1}^{K} \lambda(d(x) \mid \omega_j) P(\omega_j \mid x)$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

risques (2)

- risque associé à la règle de décision d
 - espérance du risque conditionnel

$$C(d) = \int_{\mathbb{R}^d} C(d(x)|x) p(x) dx$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

22

Règle optimale d*

- d* est la règle qui minimise C(d)
- -> Pour chaque x, on minimise C(d(x)|x)
- soit x donné, on décide d*(x)=i si

$$C_i(x) = C(\omega_i | x) \le C_j(x) = C(\omega_j | x)$$
 $j = 1, 2, ..., K$ sans rejet $j = 0, 1, 2, ..., K$ avec rejet

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

23

risque Bayésien

• risque bayésien = risque moyen associé à la règle de décision d* :

espérance du risque conditionnel C(d*(x)|x):

$$C^* = E[C(d^*(x)|x)] = \int_{R^d} C(d^*(x)|x) p(x) dx$$

 les réalisations sont classées par la règle bayésienne du risque conditionnel minimum :

$$d^*(x) = \underset{{}_{i=0,1,K}}{Arg} \min^{C(\omega_i|x)} \text{ et } C^*(x) = C(d^*(x)|x) = \min_{{}_{i=0,1,K}} C(\omega_i|x)$$

$$C^* = \int_{\mathbb{R}^d} C^*(x) p(x) dx$$

L. Likforman - Telecom Paris Tech - SI 221

règle de Bayes à pénalisation symétrique

 $\begin{array}{lll} \lambda(\omega 0 \bigm| \omega j) = \lambda r & \forall \ j = 1, \dots, K \\ \lambda(\omega i \bigm| \omega j) = 1 & \textit{si} \ i \neq j \ \forall \ j = 1, 2, \dots K \\ \lambda(\omega i \bigm| \omega i) = 0 & \forall \ i = 1, \dots, K \end{array}$

Coût de rejeter x : $C_0(x) = C(\omega_0|x) = \sum_{j=1}^K \lambda_R P(\omega_j|x) = \lambda_R$

Coût de décider ωi :

$$C_i(x) = C(\omega_i|x) = \sum_{j=1, j\neq i}^K P(\omega_j|x) = 1 - P(\omega_i|x) = P(C \neq i|x)$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

décision

on décide d*(x)=i si

$$C_{i}(x) = \sum_{j=1, j \neq i}^{K} P(\omega_{j}|x) = 1 - P(\omega_{i}|x) \le C_{j}(x) \ \forall j = 1, 2, ... K$$
 et si $C_{i}(x) \le C_{0}(x)$

On rejette si $C_0(x) \le C_j(x)$ $\forall j = 1,2,...K$

 $\begin{array}{ll} \text{Autre formulation: } \mathbf{d}^*(x) = \mathbf{i} \ \text{si P} \left(\omega \mathbf{i} \mid x \right) > = \ \mathbf{P} \left(\omega \mathbf{j} \mid x \right) \quad \forall \ \mathbf{j} = 1, \dots, K \\ \mathbf{et} \quad P(\omega_{\mathbf{j}} \mid x) \geq 1 - \lambda_{\mathcal{R}} \end{array}$

Rejet si $\max_{j=1}^{K} P(\omega_j|x) \prec 1 - \lambda_R$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

probabilités d'erreur conditionnelles

 e*(x)=probabilité conditionnelle d'erreur associée à la décision optimale d*

$$e^*(x) = P(erreur|x) = P(C \neq d^*(x)|x) = 1 - P(d^*(x)|x)$$

 $e^*(x) = 1 - \max_{i} P(\omega i|x)$

 e_i(x) =probabilité conditionnelle d'erreur associée à la décision d(x)=i (optimale ou non)

$$e_i(x) = P(C \neq i|x) = 1 - P(C = i|x) = 1 - P(\omega i|x)$$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

influence de λ_R

Seuil de rejet : $0 \le \lambda_R \le \frac{K-1}{K}$

Espace de représentation : $R = R_0 \cup R_A$

$$R_A = \bigcup_{i=1,...K} R_i$$

Influence du seuil de rejet :

 $\lambda_1 \le \lambda_2$ alors $R_A(\lambda_1) \subset R_A(\lambda_2)$

I. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

probabilités acceptation/rejet

Probabilité de classement $P_{Ai} = \int_{p_i} p(x)dx$

Probabilité globale d'acceptation $P_A = \int_{RA} p(x) dx = \sum_{i=1}^K P_{Ai}$

Probabilité de rejet $P_R = \int_{R_0} p(x) dx$

I. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 = 2010

probabilités d'erreur

Probabilité d'erreur de classement dans ωi

$$P_{Ei} = \int_{p_i} e^*(x) p(x) dx$$

 $avec e^*(x) = P(erreur|x)$

Probabilité globale d'erreur : $P_{\scriptscriptstyle E} = \int\limits_{\scriptscriptstyle R_{\scriptscriptstyle A}} e^*(x) p(x) dx$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

10

probabilité de bon classement

Dans la classe ωi :

$$P_{C_i} = \int_{R_i} (1 - e^*(x)) p(x) dx$$

Probabilité globale de bon classement

$$P_C = \int_{RA} (1 - e^*(x)) p(x) dx = \sum_{i=1}^K Pc_i$$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

Suite...

On a :
$$P_{\scriptscriptstyle A} + P_{\scriptscriptstyle R} = 1$$

$$P_{\scriptscriptstyle A} = P_{\scriptscriptstyle C} + P_{\scriptscriptstyle E}$$

$$P_{\scriptscriptstyle C} + P_{\scriptscriptstyle E} + P_{\scriptscriptstyle R} = 1$$

 P_A , P_E , P_R et P_C dépendent de λ_R

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

risque Bayésien

$$C^* = \int_R C^*(x) p(x) dx \quad \text{Avec } C^*(x) = C(d^*(x)|x)$$

$$C^* = \int_{R_A} C^*(x) p(x) dx + \int_{R_0} C^*(x) p(x) dx$$

Règle des coûts 0-1:

$$C^*(x) = e^*(x) = 1 - \max_{i=1,..K} P(\omega i | x) \ pour \ x \in R_A$$

L. Likforman - Telecom Paris Tech - SI 221 – 2010

33

Règle des coûts 0-1 : C*(x) = e*(x)

$$C^* = \int\limits_{R_A} e^*(x) p(x) dx + \int\limits_{R_0} \lambda_R p(x) dx$$

 $C^*=P_E + \lambda_R P_R$

 C^* = risque minimum=risque bayésien

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

rapport de vraisemblance

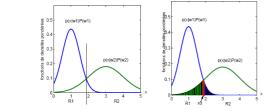
d*(x)=1 si

$$\Lambda(x) = \frac{p(x \mid \omega_1)}{p(x \mid \omega_2)} > \frac{\lambda(\omega_1 \mid \omega_2) P(\omega_2)}{\lambda(\omega_2 \mid \omega_1) P(\omega_1)} = \eta$$

d*(x)=2 sinon

probabilité d'erreur

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010



$$\begin{split} &P(erreur) = P(X \in R_1, \omega_2) + P(X \in R_2, \omega_1) \\ &= P(X \in R_1 \big| \omega_2 \) P(\omega_2) + P(X \in R_2 \big| \omega_1) P(\omega_1) \end{split}$$

 $= \int\limits_{R1} p(x\big|\omega_2)P(\omega_2)dx + \int\limits_{R2} p(x\big|\omega_1)P(\omega_1)dx$

I. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

Exemple: vérification d'identité

- problème à 2 classes
- ω1 : clients du système
- ω2 : imposteurs
- Décision :

$$s(x) = \frac{p(x \mid \omega_1)}{p(x \mid \omega_2)} \stackrel{\omega_1}{>} r_0$$

I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

37

erreurs de type I et II

H0 - hypothèse nulle: absence d'imposteur

- \blacksquare $P_E^1:$ Erreur de type 1 (rejeter H0 de manière erronée): rejeter un client ou faux rejet (fausse alarme, faux positif)
- P_E²: Erreur de type 2 : (accepter H0 de manière erronée): accepter un imposteur ou fausse acceptation (détection manquée, faux négatif).

ice, laux negatii/	ω1: client	ω2:imposteur
d(x)=1	correct	type 2
d(x)=2	type 1	correct

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

Suite...

 $P_E^2 = P(\text{d\'ecider }\omega 1, \omega 2 \text{ est vrai}) \text{ prob. jointe}$

 $P_E^2 = P(d(x) = 1 \big| \omega 2) P(\omega 2) = \int p(x \big| \omega 2) P(\omega 2) dx$

 $P_E^2 = \int P(\omega 2|x) p(x) dx$

 $P_E^1 = P(\text{décider } \omega 2, \omega 1 \text{ est vrai})$

 $P_E^1 = \int_{R_2} p(x|\omega 1)P(\omega 1)dx = \int_{R_2} P(\omega 1|x)p(x)dx$

$$P_E = P_E^1 + P_E^2$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

vérification d'identité: FRR-FAR

- espace de représentation
- probabilités conditionnelles

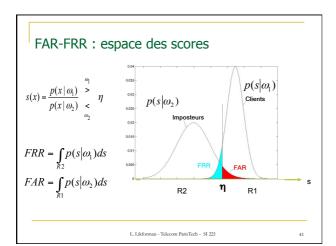
Taux de faux rejet = FRR= P(d(x)=2| ω 1 est vrai) Taux de fausse acceptation = FAR= P(d(x)=1| ω 2 est vrai)

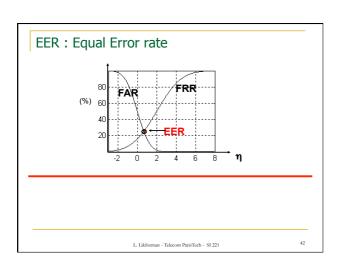
$$FRR = \int_{R2} p(x|\omega_1) dx$$

$$FAR = \int p(x|\omega_2)dx$$

$$P_E = P(\omega_1)FRR + P(\omega_2)FAR$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221





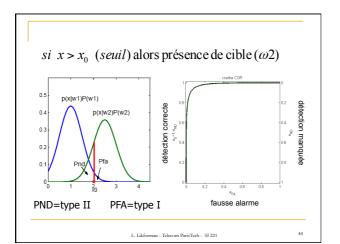
Courbe ROC

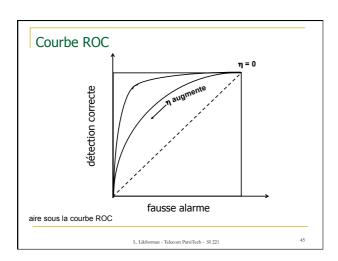
■ COR : Caractéristique Opérationnelle du Récepteur

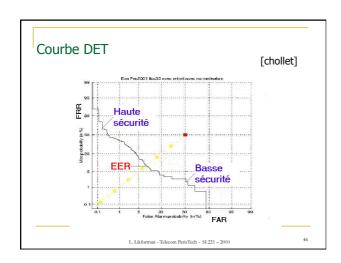
 $\hfill \omega$ 1 : absence d'objet □ ω2 : présence d'objet

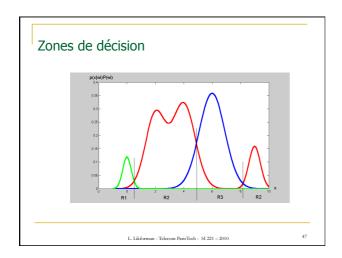
- incrémentation du seuil de décision
 - □ courbe Probabilité détection correcte en fonction probabilité de fausse alarme

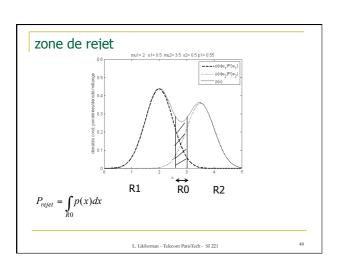
L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

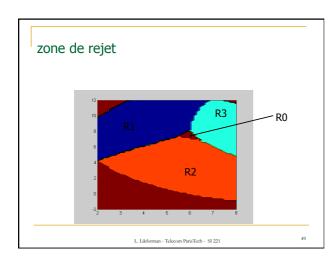












distributions normales

 M : vecteur moyenne classe ω

$$X = \begin{pmatrix} X_1 \\ X_2 \\ X_d \end{pmatrix} \qquad M = \begin{pmatrix} E(X_1) \\ E(X_2) \\ E(X_d) \end{pmatrix}$$

 Σ: matrice de covariance classe ω

 ${\color{red} \bullet} \quad {\sf E}[({\sf X-M})({\sf X-M})^t|\omega]$

 Σ est symétrique définie positive

$$p(x|\omega) = \frac{1}{(2\pi)^{d/2} |\Sigma|^{1/2}} e^{-\frac{1}{2}(x-M)^t \Sigma^{-1}(x-M)}$$

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

distributions normales (suite)

Σ: matrice de covariance

 $\ \ \square$ variance $\sigma^2_{\ i}$ (caractéristique Xi)

$$\Sigma = \begin{bmatrix} \sigma_1^2 & \sigma_{12} \\ \sigma_{21} & \sigma_2^2 \end{bmatrix}$$

$$\sigma_i^2 = E[(X_i - E(X_i))(X_i - E(X_i))]$$

$$\sigma_{ij} = E[(X_i - E(X_i))(X_j - E(X_j))]$$

$$= E(X_i X_j) - E(X_i)E(X_j)$$

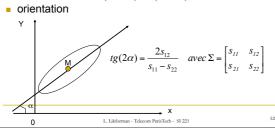
I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

ellipsoide de Mahalanobis

lieu des points

$$U = \begin{bmatrix} X \\ Y \end{bmatrix}$$

$$(U-M)^t \Sigma^{-1}(U-M) = Cte$$



ellipsoide de Mahalanobis

décomposition: Σ symétrique

 $\Sigma = V * \Sigma_d * V^t$

V: matrice des vecteurs propres $V = \begin{bmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$

$$\Sigma_{\rm d} = \begin{bmatrix} \lambda 1 & 0 \\ 0 & \lambda 2 \end{bmatrix}$$
 matrice diagonalisee

$$\Sigma = R^{-1} * \Sigma_d * R$$

R: matrice de passage de (R) à (R') R =

L. Likforman - Telecom ParisTech - SI 221

ellipsoide de Mahalanobis

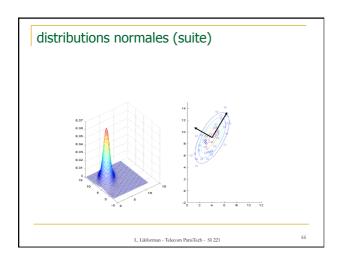
grand axe, petit axe

□ repère de l'ellipsoide (R')

$$\frac{X'^2}{\lambda_1} + \frac{Y'^2}{\lambda_2} = Cte$$

1/2 grand $axe: \propto \sqrt{\max(\lambda_1, \lambda_2)}$

1/2 petit axe: $\propto \sqrt{\min(\lambda_1, \lambda_2)}$

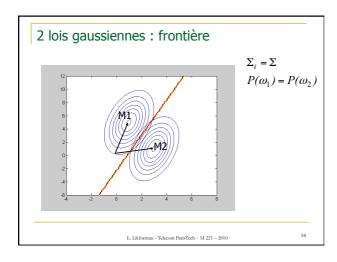


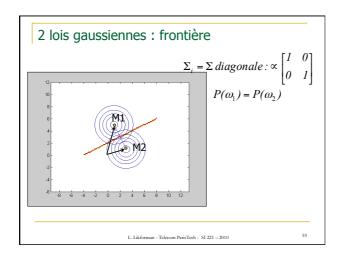
Conclusion: décision Bayésienne

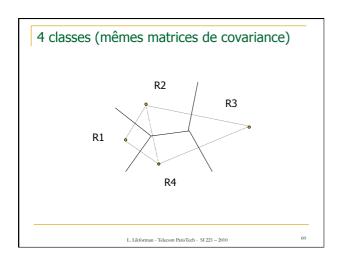
- cadre d'application
 - □ Les distributions p(x|wi), P(wi) doivent etre connues
 - □ Sinon, il faut pouvoir les estimer (#échantillons suffisant)
- avantages/inconvénients
 - Classification optimale
 - □ Mise en œuvre simple
 - Estimation peut être délicate
- complexité
 - □ paramètres des modèles de classe

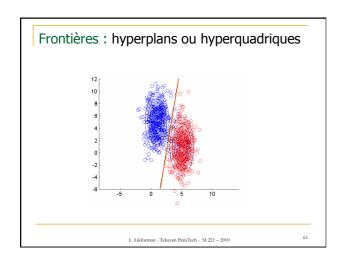
I., Likforman - Telecom ParisTech - SI 221 – 2010

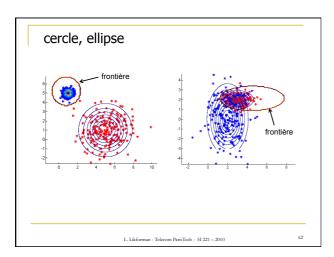
ellipsoide de Mahalanobis











Conclusion: décision Bayésienne cadre d'application Les distributions p(x|wi), P(wi) doivent etre connues Sinon, il faut pouvoir les estimer (#échantillons suffisant) avantages/inconvénients Classification optimale Mise en œuvre simple Estimation peut être délicate complexité paramètres des modèles de classe